

## 第 15 回 MaSC 技術交流会 “Real Exchange”

2025 年 7 月 9 日（水）、片平北門会館 2 階エスパスにて「第 15 回 MaSC 技術交流会 “Real Exchange”」を開催しました。今回のテーマは「匠の技が冴える微細な世界 WAZA-ALI 解析技術」です。会場は早期に満席となり、約 60 名の方にご参加いただきました。



前半では、MaSC の分析装置を担当している技術職員より、各表面分析・加工装置の測定原理や対象とする範囲、強みやそれぞれの違い、変わった分析事例などの紹介が行われました。サンプル前処理やオプション機能など、実際の測定に役立つ情報も盛り込まれた実践的な内容でした。企業講演では、(株)トーキンの千葉様より製品開発プロセスにおける分析手法の活躍場面、(株)タムラ製作所の小淵様より顧客課題への分析技術を用いたアプローチ等についてお話頂きました。いずれも高度な分析が企業価値となっていることが伺えるご発表でした。後半では、コアファシリティの実際の利用方法について坂園 URA からのご紹介を頂き、特別講演として IMRAM 寺内教授より、SXES の開発者としてその強みや放射光施設との相補的な活用についてお話頂きました。パネルディスカッションでは産学の多様な立場から、より良いアプローチや今後の取り組みについて活発な討議がなされました。



隣接会場セリシールでの立食形式の意見交換会も、イベントの熱気そのままに、各所で活発な議論が交わされ、参加者同士の新たなつながりの創出の場となりました。

## プログラム

### ◆開会の挨拶

産学連携先端材料研究開発センター長/多元物質科学研究所 所長 福山博之教授

### ◆ 分析装置紹介：分析で何がわかるのか？～事例紹介を交えて～

「MaSC が保有する分析装置とそれらで出来ること」 真柄英之 技術専門職 (IMRAM)

「SEM-EDS 材料の「かたち」と「中身」をつかむ顕微鏡分析」 小澤真美子 技術主任 (IMRAM)

「EPMA-SXES 特性 X 線を用いた微小領域の材料解析」 田代公則 技術専門職員 (IMRAM)

「XPS X 線で探る、材料表面のナノの世界」 雁部祥行 技術専門職員 (IMRAM)

「XRD 微細構造解析のはじめの一歩」 村上義弘 技術専門員 (IMR)

「FIB 試料加工例のご紹介」 佐藤香織 技術専門職員 (IMR)

### ◆ 企業講演：分析事例と大学との連携

「材料開発における分析技術の活用 ～磁性材料を中心に～」

株式会社トーキン研究開発本部 千葉美帆様

「プリント回路基板と関連部材の分析事例」

株式会社タムラ製作所 電子化学実装事業本部 分析技術統括部 小淵早瑛様

### ◆ 「共用装置の利用を支えるコアファシリティ統括センターの活動紹介」

コアファシリティ統括センター 坂園聡美 特任准教授 (上席 URA)

### ◆ 特別講演「軟 X 線を使った材料分析技術 (SXES) で何が分かるか」

多元物質科学研究所 寺内正己 教授

### ◆ パネルディスカッション

「これからの材料研究にどう寄り添うか

～個別分析技術の進展とナノテラスを含めたマルチモーダル、マルチスケール化への対応～」

